



PHYSICAL ELECTRONICS GMBH

Neu in  
unserem Labor  
AES

## NanoX-Pert Technische Schichtsysteme

Im Fokus: Schichtsysteme - Schichtaufbau und Fehleranalytik  
untersucht mit TOF-SIMS, XPS und Auger  
**Interdisziplinäre Technologien für die komplexen  
und zukunftsweisenden Forschungs- und  
Entwicklungsfelder der Materialwissenschaften  
und Werkstoffkunde**

Leitung: Stefan Reichlmaier

**Termin: 20.10.2021**

Ort: 85622 Feldkirchen bei München, Salzstraße 8  
**Physical Electronics GmbH**



PHI GmbH's INHOUSE Seminare 2022:  
Sharing X-Perience mit NanoX-Pert  
NanoX-Pert NanoScience (April 2022)  
NanoX-Pert Life Science (Oktober 2022)

Das Seminar ist kostenlos, inklusive Catering und Informationsmaterial. Zur Teilnahme müssen alle Teilnehmer registriert sein.

Registrierung mittels E-Mail: [szauzig@phi-europe.com](mailto:szauzig@phi-europe.com)

Registrierung bis 01.10.2021

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Abteilung/Position

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ; Ort

\_\_\_\_\_  
Tel./Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

Die Datenschutzerklärung <https://phi-gmbh.eu/privacy-policy/>  
habe ich zur Kenntnis genommen.

**Speicherung der Daten**

Ja, hiermit bestätige ich das Physical Electronics GmbH im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für uns geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen, meine persönlichen Daten elektronisch speichern darf. Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

**Die Agenda des Tages:**

09:15 Registrierung  
09:30 Begrüßung und Einleitung

09:35 Anwendungsbeispiele: Technische Schichtsysteme in  
Optik und Elektronik (TOF-SIMS, XPS, Auger)

10:40 Kaffeepause

11:00 Vorstellung der Methode ToF-SIMS

11:20 **TOF-SIMS Anwendungen aus der Automobilbranche**  
**Dr. Poll Audi AG**

11:50 Vorstellung der Methode XPS  
Vorstellung der Methode AES

12:30 Mittagessen (Buffet)

13:30 Praktischer Teil (3 Gruppen á 20 min)  
ToF-SIMS; XPS; AES

14:30 Vorstellung Timegated Raman Spectroscopy,  
Industrielle X-Ray Radioskopie & Computertomografie  
& Analytik für technische Schichtsysteme

15:00 Kaffeepause

15:15 Die Neuesten Entwicklungen, im Bereich  
Oberflächenanalytik: Methoden: UPS/XPS/HAXPES,  
Clusterquellen und TOF-SIMS mit Parallel Tandem MS

16:00 Zusammenfassung:  
Testmessungsgutschein & Feedback

16:15 Möglichkeit zur Diskussion Ihrer  
individuellen Fragestellung

16:30 Ende des Seminars

*Unter Vorbehalt eventuell Änderungen, diese werden  
rechtzeitig bekanntgegeben.*

Neu:  
Industrie Talk  
AUDI AG

#### Zielsetzung:

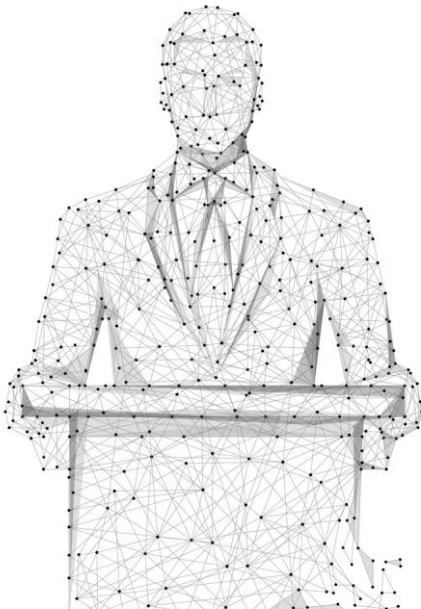
Dieses Seminar vermittelt Ihnen durch eine interdisziplinäre Herangehensweise einen Überblick über die wichtigsten oberflächenanalytischen Methoden und gibt Ihnen ein Verständnis für deren Anwendung.

#### Typische Fragestellung:

- Wie bewerten Sie als Experte das Alterungsverhalten von Beschichtungen?
- Haben Optimierungen und Maßnahmen funktioniert?

Das Seminar stellt Ihnen analytische Nachweisverfahren für die Untersuchung von Nanoschichten oder zur Fehleranalytik und Qualitätskontrolle vor.

Freuen Sie sich auf die Vorstellung der neuesten Geräteentwicklungen, in der Oberflächenanalytik! Unser Seminar, genau das Richtige für Sie.



#### Kontaktinformationen:

Anmeldung zum kostenlosen Seminar inklusive Testmessungs-Gutschein für Neukunden, Verpflegung während des Seminars sowie Unterlagen zum Themengebiet. Ihre Anmeldung richten Sie bitte per E-Mail, auf dem Postweg bzw. per Telefon oder Fax an:

#### Physical Electronics GmbH

z. Hd. Stefanie Zauzig

Salzstraße 8

D-85622 Feldkirchen bei München

TEL. +49/89/96 275-0

FAX +49/89/96 275-50

Email [szauzig@phi-europe.com](mailto:szauzig@phi-europe.com)

URL [www.phi-gmbh.eu](http://www.phi-gmbh.eu)

Auch bei sonstigen Fragen zum Seminar steht Ihnen Frau Zauzig gerne zur Verfügung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, darum bitten wir Sie, sich rechtzeitig anzumelden. Sie können leider nicht teilnehmen? Gerne senden wir Ihnen Informationsmaterial über alternative Termine zu.



**P**HYSICAL ELECTRONICS GMBH

#### XPS (Röntgenphotoelektronenspektroskopie)



#### TOF-SIMS (Sekundärionenmassenspektrometrie)



#### AES (Augerelektronenspektroskopie)

